# SYNTHESE DES TRAVAUX ET PROPOSITIONS DE LA CELLULE "CENTRE DE CARACTERISATION"

Novembre 2004

# TABLE DES MATIERES

Introd	uction	5
1. E	tat actuel de la caractérisation	5
1.1	Etat des lieux des installations existantes	5
1.2	La caractérisation au laboratoire : avantages d'une vue d'ensemble	6
2 L	es expérimentations au LAAS : un paysage riche et diversifié	7
2.1	Les catégories d'expérimentations	7
2.2	Les contraintes et facilités	
3 Q	uelles possibilités pour demain ?	8
4 A	nnexes	9
4.1	Fiches de spécification des bancs d'expérimentation	9
4.2	Esquisses et propositions de plans	14
4.3	Le tableau des facilités	18
4.4	Les implantations possibles	21
4.5	Descriptif des expérimentations	22
Concli	usion	22

#### Introduction

A l'occasion de la COM2i 2003, a été évoquée la question de la caractérisation au LAAS-CNRS, dans son ensemble. De ce questionnement est née la cellule "Centre de caractérisation", composée de chercheurs, ingénieurs et techniciens impliqués dans la caractérisation au laboratoire, qu'elle soit relative à l'électronique, aux hyperfréquences, à l'optique, ou aux microsystèmes. Ce groupe de personnes a été chargé de redéfinir les contours du Centre de caractérisation existant, de réfléchir à ses modalités de fonctionnement, et d'organiser l'implication des personnes concernées.

Depuis un an maintenant, la cellule s'est régulièrement réunie, à raison d'une fois par mois, mettant en commun non seulement les données matérielles et techniques, mais aussi les idées et concepts innovants pour la mise en place d'un centre de caractérisation dynamique et performant.

De ces quelques mois de réflexion est issue la synthèse présentée dans ce document. Y sont communiqués l'état des lieux de la caractérisation au laboratoire aujourd'hui, les spécificités techniques et les besoins de chacun en terme de développement d'expérimentation.

#### 1. ETAT ACTUEL DE LA CARACTERISATION

#### 1.1 Etat des lieux des installations existantes

Les expérimentations sont aujourd'hui réparties dans de nombreuses salles dont le récapitulatif est donné dans le Tableau 1.

Plusieurs salles sont situées en sous-sol ou en rez-de-chaussée, où elles bénéficient d'une très bonne isolation aux vibrations (salle hyperfréquences par exemple dans laquelle ont été installées les manipulations les plus sensibles). Néanmoins, ces salles sont régulièrement inondées. Le morcellement des zones sur plusieurs salles (excepté pour la caractérisation électrique) est un facteur pénalisant pour les échanges, qu'ils soient matériels ou intellectuels.

Caractérisation	Types de tests	Localisation	Surface	Total
Electrique	.Tests paramétriques .Localisation/mesure de points chauds .Caractérisation de substrats et de composants discrets	Bât. A, sous-sol	115m <sup>2</sup>	115m <sup>2</sup>
Hyperfréquences	.Mesures de paramètres S .Banc de fiabilité de commutateurs MEMS hyper entièrement automatisé	E35 (1 <sup>er</sup> étage)	45m <sup>2</sup>	
	.Banc de mesure DC .Mesure de bruit	Bât. E, sous-sol	65m <sup>2</sup>	110m2
Optique	.Tests paramétriques : puissance, tension, spectre .Caractérisation de composants .Spectroscopie	C86 et C88	72m <sup>2</sup>	
	.Test matériaux	C174b	$6m^2$	
	.Réflectivité	C147a	$6m^2$	
	.Caractérisation de composants	S28	51.5m <sup>2</sup>	
	.Fabrication et caractérisation réseaux	S12	18m <sup>2</sup>	153.5m <sup>2</sup>
Microsystèmes	.Caractérisation générale	Bât. A, sous-sol	$32m^2$	
	.Caractérisation mécanique .Caractérisation de microsystèmes pour la chimie et la biologie .Systèmes de dépôts .Caractérisations spécifiques	S18 et S20	68m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>
TOTAL				478.5m <sup>2</sup>

Tableau 1 : Récapitulatif des surfaces et localisations des expérimentations

#### 1.2 La caractérisation au laboratoire : avantages d'une vue d'ensemble

Les équipements évoluent avec les recherches, le besoin de visibilité tant interne qu'externe augmente avec la complexité des expérimentations, le partage des ressources (équipements et compétences) crée une plus grande synergie et améliorent les échanges, ainsi que les résultats. A l'instar de la salle de caractérisation électrique initiée par G.Charitat, ces différents points plaident pour le rapprochement des moyens d'expérimentation dont le laboratoire dispose.

Les avantages en interne d'une vue d'ensemble de la caractérisation sont multiples : meilleure adéquation entre soutien technique et besoins de la recherche, meilleure utilisation des moyens et des compétences déjà disponibles et dans le futur, meilleure coordination des investissements, identification plus aisée des besoins, interactions facilitées.

A cela, on peut ajouter une meilleure visibilité des activités et technicités du LAAS pour nos partenaires extérieurs, et un potentiel à faire valoir plus facilement.

En outre, l'évolution des différentes "aires" (électrique, hyperfréquences, optique, microsystèmes) montrent une forte intersection entre ces domaines techniques. Le document

"Descriptif des bancs de caractérisation électrique, hyperfréquences, optique et de microsystèmes", Sept. 2004 (cf. Annexe 4.5), illustre l'existence de ces liens qui se concrétisent par des échanges de matériels, d'idées et des transferts de compétences.

#### 2 LES EXPERIMENTATIONS AU LAAS: UN PAYSAGE RICHE ET DIVERSIFIE

# 2.1 Les catégories d'expérimentations

Un travail de recensement de toutes les expérimentations du laboratoire a été fait présentant :

- d'une part les objectifs propres à chaque manipulation, les responsables scientifiques, les appareils et performances, ainsi qu'une bibliographie (cf. "Descriptif des bancs de caractérisation électrique, hyperfréquences, optique et de microsystèmes", Sept. 2004),
- d'autre part les contraintes associées à chaque banc : besoins en électricité, eau, fluides, extraction, environnement particulier, nuisances et rapprochements avec d'autres matériels.

De ce travail de recensement, une vue d'ensemble a pu être dégagée, mettant à jour les liens forts qui peuvent exister entre les expérimentations. C'est ainsi qu'apparaissent des catégories d'expérimentations qui, même si elles ont pour objet d'étude des composants ou matériaux différents, se rejoignent dans les méthodes et matériels utilisés.

On peut ainsi répertorier les catégories suivantes :

- 1. Test paramétrique : I, V, t, Puissance lumineuse, Fréquence, Impédance, Paramètres S
- 2. Caractérisation de substrats / matériaux
- 3. Microsystèmes
- 4. Mesure de température / thermographie
- 5. Mesure de bruit (hyperfréquence + optique)
- 6.Spectroscopie

#### 2.2 Les contraintes et facilités

Les fiches de spécifications (cf. Annexe 1) montrent que pour atteindre les objectifs scientifiques pertinents, des contraintes doivent être respectées :

- besoins en fluides et apports énergétiques : Eau de refroidissement pour les lasers, aspiration pour le maintien des plaquettes, azote,...
- proximité avec d'autres appareils ou infrastuctures :

Sources lasers en optique, salle blanche, hottes pour la bio-chimie par exemple. Cette contrainte, partagée par les différentes "aires" (besoin de matériel de la salle électrique pour l'optique, et de matériel optique pour les hyperfréquences) plaident pour une véritable proximité de ces zones d'expérimentation.

- éloignement d'autres installations, ou contre-indications : Eviter la haute-tension et tout matériel générant des interférences électromagnétiques, éviter les sources lumineuses près des bancs optiques, éviter les zones inondables (comme le sont actuellement les salles de manipulation en sous-sol).
- installation des bancs sensibles dans les zones les moins sujettes aux vibrations :

Prévoir les zones optiques et hyperfréquences, ainsi que certains appareils de la salle de caractérisation électrique (ex : AFM) en rez-de-chaussée (étages exclus).

Plusieurs niveaux d'exigence apparaissent ainsi :

# la nécessité de regrouper les expérimentations par blocs :

Electrique, hyperfréquence, microsystèmes, optique, bio et chimie. Ces zones partagent du matériel commun (hottes, stations sous pointe, lasers, monochromateur) formant un point central autour duquel s'organisent les bancs. Ceci implique de prévoir d'assez grandes surfaces d'accueil (cf. Tableau 1), tout en anticipant raisonnablement l'évolution des bancs d'expérimentation.

# ➤ <u>la préférence pour un rapprochement des aires de caractérisation</u>:

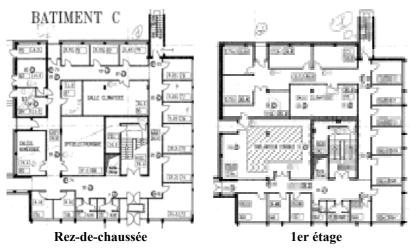
Les projets émergents depuis quelques temps font apparaître de plus grandes interactions entre des domaines autrefois plus cloisonnés : projets EMVISI (microélectronique et optique), OPTOHYPER (hyperfréquences et optique), MICROSIAM (microélectronique et hyperfréquences). Cette évolution plaide pour un rapprochement des blocs évoqués précédemment.

# 3 QUELLES POSSIBILITES POUR DEMAIN?

Dès le second semestre 2005, les 276m² de la salle blanche actuelle seront libérés (2ème étage, bât. C). Cette salle est aujourd'hui climatisée dans de bonnes conditions mais doit être revue dans son agencement (modification de cloisons, révision des circuits de gaz,...).

Les salles MBE (71.5m²) et RTP (21m²) ainsi que la salle d'assemblage (35m²), au 1<sup>er</sup> étage du bâtiment C seront libérées à l'issue de la construction de la seconde tranche du bâtiment Jean Lagasse. A cette date, le 1<sup>er</sup> étage du bâtiment C présentera donc une surface libre de 127.5m².

Au rez-de-chaussée de ce même bâtiment deux salles sont aujourd'hui occupées (35m² et 37.5m²) qui sont équipées de manière inégale : circuit d'azote installé récemment mais climatisation peu fiable associée à un taux d'humidité important, pas de protection aux interférences électromagnétiques (présence du transformateur pour les bâtiments C et G, au rez-de-chaussée).





Plan 1 : Plans du bâtiment C

Dans la 2<sup>ème</sup> tranche du bâtiment Jean Lagasse, seront disponibles au rez-de-chaussée :les surfaces rectangulaires de 201m<sup>2</sup> (14 x 14.5m<sup>2</sup>) et 280m<sup>2</sup> (16 x 17.5m<sup>2</sup>) d'un seul tenant chacune.

Au premier étage, une partie de la surface est réservée à l'extension de la salle blanche, une autre montre une surface disponible de 200.5m<sup>2</sup>, quasiment carrée.

# 4 ANNEXES

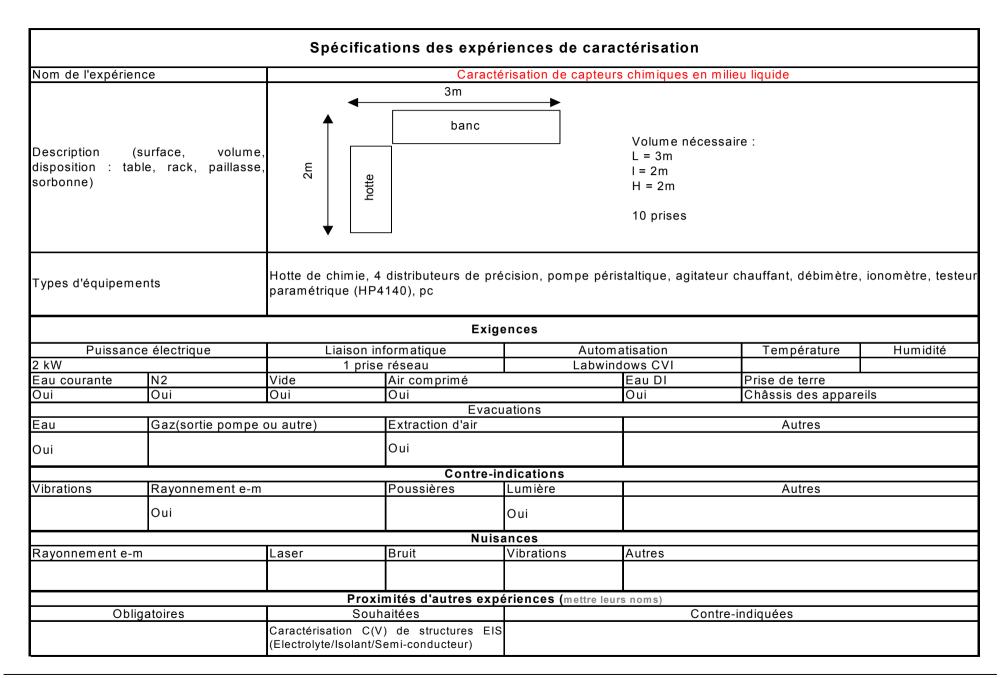
# 4.1 Fiches de spécification des bancs d'expérimentation

Les fiches qui suivent ont été remplies pour chaque banc de manipulation et constituent un travail préliminaire à l'élaboration du tableau des facilités présenté dans l'annexe suivante. Au total, 30 fiches ont été remplies : 19 pour la caractérisation électrique et microsystèmes, 4 pour les hyperfréquences, 7 pour l'optique. A cela, viendront s'ajouter les fiches des expérimentations en cours de montage.

Nous donnons ici quatre exemples qui montrent la variété des contraintes liées aux bancs d'expérimentation.

		Spécifica	tions des expér	iences de car	actérisation						
Nom de l'expérie	ence		Caractér	sation bas niveau	(Mesure de I, V et t	) + C(V) HF					
•	(surface, volume, able, rack, paillasse,										
Types d'équipem	nents	1 testeur sous poir			ue Keithey 4200+ 1 to	esteur paramétrique Aç	gilent HP4156				
			Exig	ences							
	nce électrique		formatique		matisation	Température	Humidité				
3 kW			s réseau	ICS, IC CA	AP, Labwindows						
Eau courante	N2	Vide	Air comprimé	0=01/	Eau DI	Prise de terre					
oui	oui	oui	oui (P> 2.5b et D>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Ган	Co=/oortio nomno	··· o··tro		ıations		Autros					
Eau	Gaz(sortie pompe	ou autre)	Extraction d'air			Autres					
oui											
				dications							
Vibrations	Rayonnement e-m		Poussières	Lumière		Autres					
			à éviter								
	•		Nuis	ances	•						
Rayonnement e-	·m	Laser	Bruit	Vibrations	Autres						
		Proxi	mités d'autres exp	é <b>riences (</b> mettre le	eurs noms)						
Ob	ligatoires		aitées	Contre-indiquées							

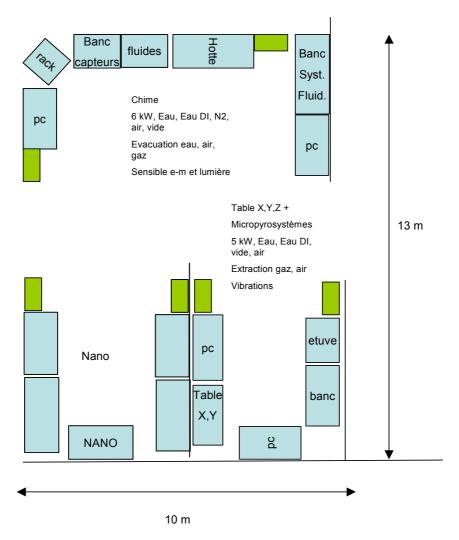
		Spécific	cations des exp	ériences de ca	ractérisation								
Nom de l'expérie	ence		Banc de	e fiabilité de commu	abilité de commutateurs MEMS et mesures para S								
	(surface, volume, able, rack, paillasse,		,9*2,4 (H) m3; rack	contenant analyseu	ır de réseau+table	e anti-vibratoire+ hotte à flux laminaire							
Types d'équipen	nents	station sous pointes + analyseur de réseau assécheur d'air + hotte à flux laminaire											
			Ex	igences									
Puissar	nce électrique	Liaison	informatique	Te	mpérature	Humidité							
	·		oui	contôlée	·	assécheur d'air pour effectuer mesures							
Eau courante	N2	Vide	Air comprimé		Eau DI	Prise de terre							
		oui	oui			oui							
			Eva	acuations									
Eau	Gaz(sortie pompe	ou autre)	Extraction d'air			Autres							
Vibrations	Rayonnement e-m		Contre Poussières	-indications Lumière		Autres							
sensible			,	on hotte flux lamina	aire)								
Rayonnement e-	m	Laser	Bruit	Vibrations	Autres	Autro							
rayonnement e-	-111	Lasei	système T° (ass										
			eximités d'autres ex	xpériences (mettre									
Ob	ligatoires	So	ouhaitées		Co	ontre-indiquées							



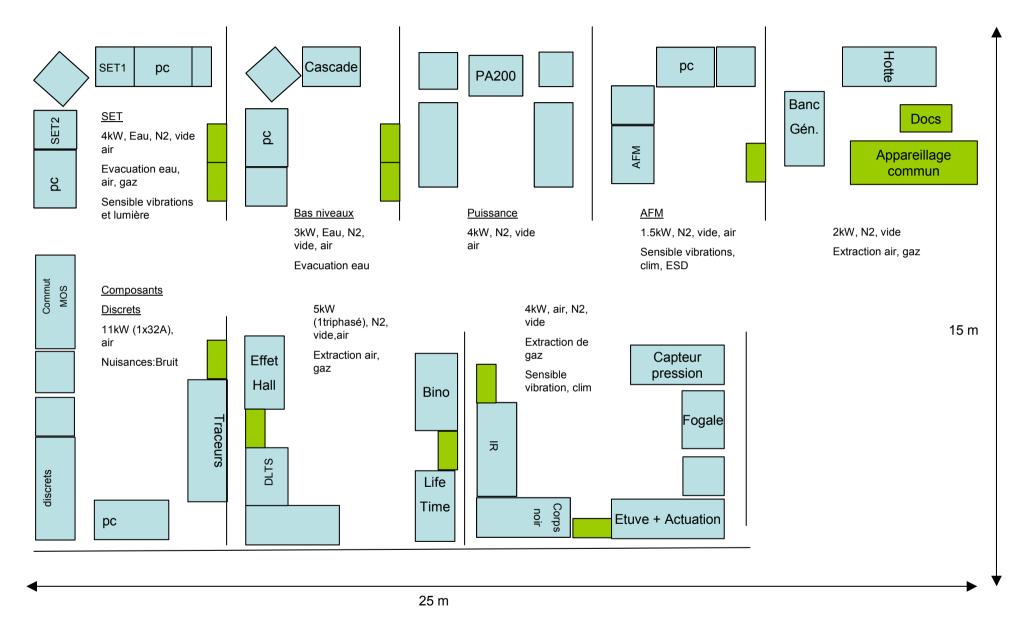
		Spécifica	ations des expé	ériences de carac	ctérisation								
Nom de l'expérie	ence	Caractérisation Ph	notoluminescence o	comme instrument de	recherche								
Description (sur	face, volume, disposition	table optique 4m2 (accès trois côtés), une armoire et une servante de rangements, étagères au-dessus de la table op											
Types d'équiper	nents	bancs optiques, porte echantillon avec platine motorisée et cryostat, source de lumiere blanche, source laser, monoc											
Exigences													
Puissance élect	rique	Liaison informatique	ue	Automatisation		Température Humidité							
	•	oui		oui		stable à 2 degré près							
Eau courante	N2	Vide	Air comprimé	•	Eau DI	Prise de terre							
oui	oui	?	non		non	oui							
Evacuations	•	•	•		•	•							
Eau	Gaz(sortie pompe	ou autre)	Extraction d'air		Autres								
oui	oui (azote et sortie	de pompe)	oui (circulation d'	azote)									
Contre-indicati	ons		<u> </u>		ı								
Vibrations	Rayonnement e-m		Poussières	Lumière	Autres								
oui	oui		oui	obscurité nécessai									
Nuisances			1		1								
Rayonnement e	-m	Laser	Bruit	Vibrations	Autres								
oui		lumière parasite	oui	oui									
	utres expériences (me												
Obligatoires		Souhaitées		Contre-indiquées									
laser accordable	e, laser Argon	Caractérisation co	mposants opto										

# 4.2 Esquisses et propositions de plans

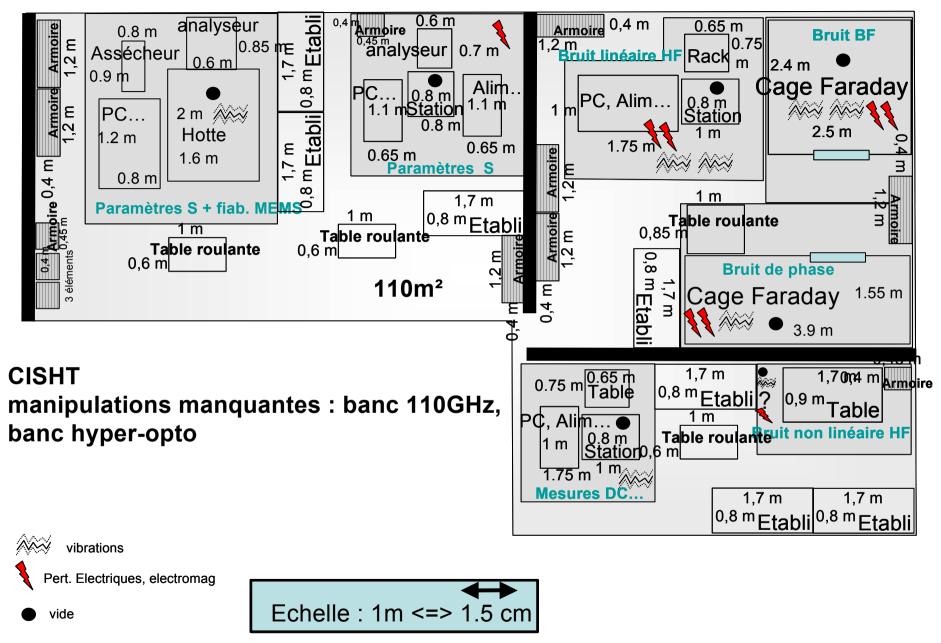
Des agencements ont été élaborés, reprenant les éléments énoncés plus haut : offrir un espace ouvert, permettant les échanges avec les expérimentations voisines (matériel partagé, compétences proches). Ces premiers plans sont une première étape reprenant les installations existantes. A ce niveau, ils ne font pas apparaître les interactions effectives ou souhaitées entre les différentes zones. Ne sont pas projetées non plus de surfaces "réservées" à l'extension des activités dans chaque zone. Du fait de la conception "sans les murs", la surface occupée par chaque bloc est réduite à son minimum.



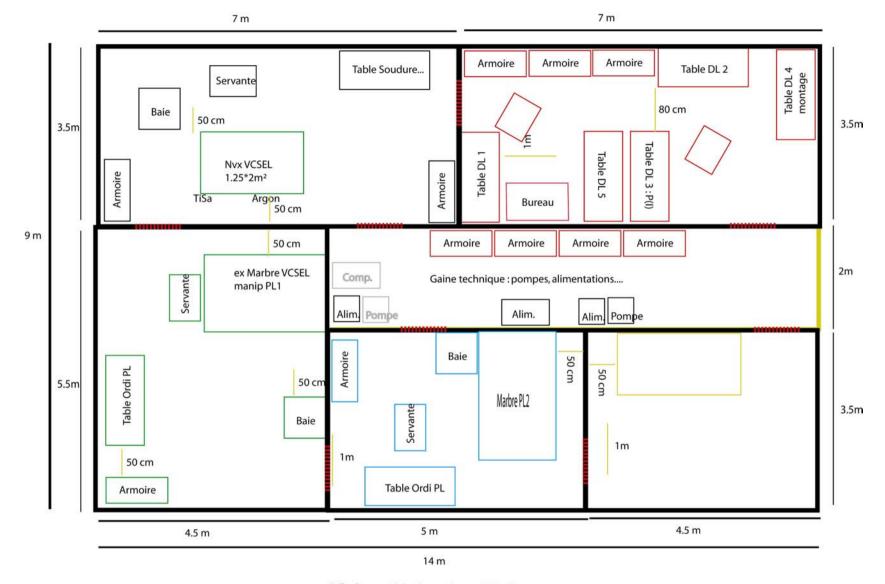
Plan 2: Proposition d'agencement des microsystèmes – 01/07/04



Plan 3: Proposition d'agencement des expérimentations électriques – 07/05/04



Plan 4 : Proposition d'agencement de la zone hyperfréquence – 07/05/04



Salle de caractérisation optique : 126 m²

Plan 5: Proposition d'implantation de la zone optique – 06/07/04

#### 4.3 Le tableau des facilités

L'ensemble des spécifications techniques a été répertorié dans les tableaux ci-après (cf. p.19 et 20). Ils font état des apports (électriques, eau, gaz,...), extractions et environnements particuliers (propre, inactinique,...) nécessaires au bon fonctionnement des expérimentations recensées. Les spécifications données ici sont à mettre en relation avec les contraintes des bâtiments et infrastructures car elles donnent une indication sur les surfaces de chaque bloc considéré (électrique, hyperfréquences, microsystèmes, optique), ainsi que les contraintes particulières à prévoir dans les locaux d'accueil (arrivées des fluides, vibrations, environnement propre,...).

DÉSIGNAT	TION				;	SPECIFICATIO	NS PHYSIQU	ES				ÉLECTRIC	ITÉ			Apport thermique	Débit Extraction	AIR COMPRIME					Azot	e Process
Équipement	Zone	Salle	En salle En gaine technique					Puissance	Puissance	Intensité	Tension	Fréquence			Pression	Attente	Taille	Débit	Pression	Attente	Taille Débit			
				Profondeur		Profondeur	Hauteur	Poids	Forme	Installée	Absorbée										Nominal			constant
			cm	cm	cm	cm	cm	kg		kW	kW	Α	V	Hz	1/11/111	KW	m3/h	bar	Nb	DN	I/min	bar	Nb	DN m3/h
CARACTERISATION	N FI FCTRIQUE	L								56						0	0	7.6	8			5	14	
		0 41	550	000			200			10	10	16	000	50/60		*	*	6,2 à 7,6	1	٠.	858		*	
Composants discrets	Carac élec	Carac élec		200						10	10	1 prise 32	220		'			6,2 a 7,6	1		858	-	لـــــا	
Effet hall	Carac élec	Carac élec	200	100			200			1		16	220	50/60	1	*	*	*	*	*	*	2	1	* *
Caractérisation inductances	Carac élec	Carac élec	300	100			200			3		16	220	50/60	-	*	*	•	*	*	*	2	1	* *
Commutation MOS	Carac élec	Carac élec	250	100			200			1		16	220	50/60	1	*	*		_ *	*	*	*	$\stackrel{\cdot}{\longmapsto}$	
Hotte	Carac élec	Carac élec	185	100			230	150		2.00	2.00		220	50 /60	1	0	1600	6	1	*	*	3.00	1	* *
Soudage	Carac élec	Carac élec	200	100			200			1		16	220	50/60	- 1	*	*	*	*	*	*	*		* *
Durée de vie	Carac élec	Carac élec	200	100			200			2		16	220	50/60		*	*	*	*	*	*	2	1	* *
Micro mirroir DLTS	Carac élec Carac élec	Carac élec	500	100			200	-		2		16	220 220	50/60 50/60	<u> </u>	*	*	*	· •	· ·	*	2	$-\frac{1}{4}$	<u> </u>
Thermographie IR	Carac elec Carac élec	Carac élec Carac élec	200 180	200 80			200			1	1	16 16	220	50/60	-	0	0	*	*	*	*	*	*	* *
Binoculaires	Carac élec	Carac élec	200	100			200			1	'	16	220	50/60	<u> </u>	*	*	*	*	*	*	2	1	* *
Profilomètre Fogale	Carac élec	Carac élec	200	200	<u> </u>		200			1		16	220	50/60	i	*	*	*	*	*	*	*	*	* *
Caractérisation électrique	Carac élec	Carac élec	400	200			200			2		16	220	50/60	I	*	*	*	*	*	*	5	1	* *
Nano indenteur	Carac élec	Carac élec	200	100			200			2		16	220	50/60	1	*	*	*	*	*	*	5	1	* *
Caractérisation de camèra	Carac élec	Carac élec	500	250			200			5		32	220	50/60	ı	*	*	*	*	*	*	*	*	* *
Micro pyros	Carac élec	Carac élec	350	250			200			4		32	220	50/60	1	*	*	5	1	*	*	*	*	* *
Puissance	Carac élec	Carac élec	300	300			200			4		32	220	50/60	_	*	*	4	1	*	5	2	1	* *
Bas niveau	Carac élec	Carac élec	400	300			200			3		16	220	50/60	1	*	*	2.5	1	*	258	2	1	* *
Standard	Carac élec	Carac élec	400	400			200			4		32	220	50/60	1	*	*	6	2	*	200	2	2	* *
Fiabilité MEMS	Carac élec	Carac élec	200	100			200			5		32	220	50/60	- 1	*	*	5	1		5	2	11	* *
CARACTERISATION M	ICBO SYSTEMS	C*								20.0						•	5000	_	40			2		
Capteur Gaz	micro systèmes	micro systèmes	500	400			200			29.2 4		32	220	50/60		0	200	6	10	*	*	2	9	* *
Caractérisation éjecteurs	micro systèmes	micro systèmes	400	100			200			3	1	16	220	50/60	i	*	*	6	1	*	*	2	1	* *
AFM nano	micro systèmes	micro systèmes	350	100			200			1.2			220	50/60	1	*	*	6	1	*	*	*	*	* *
Table XYZtheta	micro systèmes	micro systèmes	350	100			200			3		16	220	50/60		*	*	6	1	*	5	*	*	* *
Caractérisation nano ISFET	micro systèmes micro systèmes	micro systèmes micro systèmes	600 600	200 100			200			6 2		16	220 220	50/60 50/60	1	*	1600	6	1	*	5	2	2	* *
uflu 1	micro systèmes	micro systèmes	200	100			200			2	<del> </del>	16	220	50/60	l i	*	*	6	1	*	*	2		* *
μflu 2	micro systèmes	micro systèmes	200	100			200			2	1	16	220	50/60	1	*	*	6	1	*	*	2	1	* *
Froid	micro systèmes	micro systèmes	250	100			200			2		16	220	50/60		*	*	*	*	*	*	*	*	* *
Hotte 1	micro systèmes	micro systèmes	185	100			230	150		2	2		220	50 /60	1	0	1600	6	1	*	*	3.00	1	* *
Hotte 2 Etuve divers	micro systèmes micro systèmes	micro systèmes micro systèmes	185 250	100 100			230 200	150 58	desktop	2	1.2	6	220 220	50 /60 50 / 60		0 1.2	1600	6	1 *	*	*	3.00	1	* *
Préparation 1	micro systèmes	micro systèmes	250	100			200	36	uesktop	4	1.2	16	220	50/60	<u> </u>	*	*	6	1	*	*	2	<del>     </del>	* *
Préparation 2	micro systèmes	micro systèmes	250	100			200			4		16	220	50/60	1	*	*	6	1	*	*	2	1	* *
Capteurs bio	micro systèmes	micro systèmes	200	100			200			2		16	220	50/60		*	*	6	1	*	*	2	1	* *
CARACTERISAT	ION HYPER*									26.8						0	0	6	8			5	2	
MEMS Hyper	Hyper	Hyper	400	400			250			8.2	*	16	220	50/60	_	*	*	6	2	*	*	5	1	* *
Bruit de phase	Hyper	Hyper	400	200			260			3	*	16	220	50/60	1	*	*	6	1	*	*	*	*	* *
Bruit BF	Hyper	Hyper	300	300			260			1.5	*	16	220	50/60	- 1	*	*	6	1	*	*	*	_ *	* *
Paramètres S 110 Giga	Hyper	Hyper	350	300	<b>!</b>		250	<b> </b>		2	*	16	220	50/60	!	*	*	6	1	*	*	*	$\stackrel{\star}{\vdash}$	* *
Bruit HF linéaire Bruit HF non linéaire	Hyper Hyper	Hyper Hyper	300 300	400 200	}		250 250	1		1.5	*	16 16	220 220	50/61 50/60		*	*	*	1 *	*	*	*	*	* *
Mesures DC	Hyper	Hyper	300	250			250			2.6	*	16	220	50/60	i	*	*	6	1	*	*	*	*	* *
Banc opto	Hyper	Hyper	400	200			250			3	*	16	220	50/60		*	*	6	1	*	*	*	*	* *
Assemblage HF	Hyper	Hyper	550	200	ļ		250			2	*	16	220	50/60	- 1	*	*	*	*	*	*	2	1	* *
CARACTERISATIO	ON OPTIQUE*									68.1						1.5	0	6	1			5	7	
ONL	Optique	Optique	450	300	100	100	200	500		2		16	220	50/60	_	*	*	*	*	*	*	5	1	* *
VCEL	Optique	Optique	500	450			200	500		2.1		16	220	50/60	Í	*	*	*	*	*	*	5	1	* *
Photo luminescence	Optique	Optique	700	450	100	215	200	500		34			400	50/60	Ш	1	*	*	*	*	*	5	1	* *
Diodes laser	Optique	Optique	800	500	4	05-	200	500		4.5			220	50/60	_	*	*	*	*	*	*	5	1	* *
Mesures de gain	Optique Optique	Optique Optique	600 450	400 300	100	320 100	200	500 500		3 21	<del>                                     </del>		220 400	50/60 50/60		0.5	*	6	1	*	*	5 5	1	* *
Photo détecteur	Optique	Optique	250	200	100	100	200	500		1.5	1		200	50/60	- "	*	*	*	*	*	*	5	1	* *
	, ,,,	.,.,																						
·	·								·		·										-			

Proposition du Centre de Caractérisation

Novembre 2004

Columnia	DÉSIGNA	ā		VIDE Pro	ocess			ISEE			EAU DE	VILLE		EAU R	EFROIDISS	SEMENT :	14/18°C	;	Pompage	Connexion réseau	Remarques				
Career   C	Équipement	Débit	Pression	Attente	Taille	Débit	Pression	Attente	Taille	Débit	Débit	Pression	Attente	Taille	Débit	Pression	Pression	Attente	Attente Taille Débit		Attente Taille Débit		externe	163644	
CARACTERISATION  ONLY  O																			Nomin						
Concention processes of the continues		m3/h	bar	Nb	DN	m3/h	bar	Nb	DN	I/h	l/h	bar	Nb	DN	l/h	bar	bar	Nb	DN	I/mn	effluents				
Concention processes of the continues	CARACTERISATION	<b>N</b>	oui	9			oui	2				oui	4					0				31			
Control   Cont																									
Communication   Communicatio	· ·								Ŷ												,				
March   Marc				*	*				*		*		*	*	*	*	*		*		*		Azote liquide		
No.				1	*				*		*		*	*	*	*	*		*		*				
Section   Control   Cont	Commutation MOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1			
Monember   0,0   0,0   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Hotte	•	oui	1	*	*	oui	1	*	*	*	oui	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
More more   0.0   0.0   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Soudage		*	*	*				*		*	*	*	*	*				*		*	1			
OTS   60   1					*				*		*	*	*	*	*				*		*				
The Processes   18   18   18   18   18   18   18   1					*				*					*					*						
Secolare   98   7		0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	effluents				
Problemeter Engage			*	*	*	*		*	*	*	*	<u> </u>	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
Canadesiste   Canadesis   Ca				*	*	*		*	*	*	*		*	*	*	*	*		*	*	*				
More person				2	2	?	*	*	*	*	*			*		*			*		effluente				
Candenston to common   Candenston   Canden				*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*				
More prese				*	*			*	*	*	*		*	*	*	*	*		*	*					
Banness 0.6 Call 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		*	oui	1	*	*	oui	1	*	*	*	oui	1	*	*	*	*	*	*	*	*				
Besinese		0.6			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
Standard				1	*	*	*	*	*	*	*	oui	1	*	*	*	*	*	*	*	*				
Fable MEMS					*	*	*	*	*	*	*		1	*	*	*	*	*	*	*	*				
CARACTERISATION					*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*				
Capacterisation operature of 16 or 1																									
Caracterisation Sections 1.5	CARACTERISATION N	1	oui	12			oui					oui	4									15			
Caracterisation epochary   1,0   0,0   2,0   1			*	*	*	*	*		*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*		armoire gaz process avec extraction		
Tails Y/Zhed					-	_	*			*		_	-			*	_		*	-	*				
Caracterisation nano				*		*		*	*	*	*			*		*			*		*				
Set		0.6	oui	2	*	*	oui	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
Fried   0.6   0.8   0.1   1   1   1   1   1   1   1   1   1		0.6		1	*	*	oui	1	*	*	*	oui	1	*	*	*	*	*	*	*	*	3			
Find					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
Note		0.6	oui *	1 *	*	*	*	*	*	*	*		*	*		*	*		*	*	pompe *				
Hothe 2			oui	1	*	*	oui	1	*	*	*		1	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
Préparation 1		*		1	*	*		1	*	*	*		1	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
Préparation 2 0.6 out 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*		*			
CARACTERISAT  OLI  BUIL FI NOIL 1				1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*	*					
CARACTERISAT    Oui   S   Oui   1   C   C   C   C   C   C   C   C   C				1	*		•	*	*	*	*	•	*	*	*	*			*	*					
MEMS Hyper   1	Capicul's DIO	0.0	Jui	<del>- '-</del>	<del>                                     </del>		l	1			1			<del>                                     </del>			1	1		1	portipe	<u> </u>			
MEMS Hyper   *   Oui	CARACTERISAT	Ī	oui	8			non	0				non	0			non		0				8			
Brull BF	MEMS Hyper	٠	oui	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
Paramètres S 110 Giga		*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
Brut HF Infeire   File   Brut HF   Infeire   File		*			*	*	*	*	*	*	*	÷	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
Built Fron Infeatre		*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		<u> </u>		
Bancopto		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
Assemblage HF 0.3 out 1 v v v v v v v v v v v v v v v v v v		*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*				
CARCTERISATI		*			*	*	- :	*	*	*	*	-	*	*	*	*			*	*	*				
ONL ONL OLB OUI 1 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Assemblage HF	0.3	oui	1	Ė	_	<u> </u>	<u> </u>	-	-	<u> </u>	<u> </u>	_	Ĥ			<u> </u>	<u> </u>	Ė	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
ONL ONL OLB OUI 1 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	CARACTERISATI	(	oui	7			non	0				non	0			5		4		40		9			
VCEL   0.18   Oui   1   1   2   3   4   4   5   4   5   4   5   5   5   5	ONL				*	*	*		*	*	*	*	*	*	*			1	*	10	*	_			
Proto ulminescence				1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	1			
Mesures de gain         0.18         oui         1         *				1	*		*	*	*	*	*	*	*	*		5			*	6	pompe				
Insolation UV 0.18 oui 1 " " " " " " " " " " " " 4.2 " 1 " 12 " 1 zone inactinique et classe contrôle				1	*		*	*	*	*	*	*	*	*		*			*		*				
				1 1	*	*	*	*	*	*	*	<u> </u>	*	*	*				*		*		zone inactinique et classe contrôle		
				1	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*				*		*		ZONE MACHINGUE EL CIASSE CONTIOUÉ		
	20,0000			t i	t -		ì		$\vdash$					t -											

Proposition du Centre de Caractérisation

Novembre 2004

# 4.4 Les implantations possibles

En termes d'implantation dans les locaux actuels et à venir, trois solutions sont a priori envisageables :

- i. installation pour partie dans le bâtiment C, pour partie dans le bâtiment Jean Lagasse,
- ii. ensemble de la caractérisation dans le bâtiment C,
- iii. ensemble de la caractérisation dans le bâtiment Jean Lagasse.

Suite aux études présentées plus haut, il est important d'envisager l'implantation des expérimentations par blocs dont nous rappelons les caractéristiques principales ci-dessous. Ces blocs tiennent compte des regroupements thématiques ou par matériels, ainsi que de l'extension des zones due aux nouvelles manipulations en cours ou à venir :

Electrique: 200m²,
 Hyperfréquences: 120m²,
 Optique: 160m²,
 Microsystèmes: 170m².

Cette distribution est obtenue en rassemblant les microsystèmes bio-chimiques (120m² projetés) et les microsystèmes microélectroniques actuellement en salle de caractérisation électrique (50m²). La caractérisation électrique rassemble 50m² de bancs hyperfréquences proches thématiquement et matériellement des 150m² d'expérimentations électroniques, soit un total de 200m². Les installations spécifiques pour les hyperfréquences sont projetées sur 120m², celles pour l'optique sur 160m².

#### Option i:

La partie Microsystèmes est exigeante en termes d'installations du type salle blanche (hotte, extraction de produits dangereux ou toxiques). Compte tenu de ce point, les microsystèmes pourraient être installés au 2<sup>ème</sup> étage du bâtiment C (salle blanche actuelle).

Pour des raisons de surface, le bloc "Caractérisation électrique" pourrait se trouver au rez-dechaussée du bâtiment G (surface 200m², côté Ouest du bâtiment), et les hyperfréquences et l'optique dans les 280m², côté Sud du bâtiment Lagasse.

Dans ce cas de figure, resteraient disponibles au bâtiment C,  $100\text{m}^2$  au  $2^{\text{ème}}$  étage, ainsi que  $127\text{m}^2$  au  $1^{\text{er}}$  étage et  $80\text{m}^2$  en rez-de-chaussée. Dans le bâtiment J.Lagasse,  $200\text{m}^2$  au  $1^{\text{er}}$  étage (partie Ouest) seraient également libres.

Cette solution présente l'avantage d'occuper, en regroupant les bancs bio-chimie actuellement dispersés en sous-sol, les premiers mètres carrés qui seront libérés à la livraison de la première tranche du bâtiment J.Lagasse. En revanche, elle éloigne une partie des microsystèmes actuellement solidaires de la salle de caractérisation électrique (nano-indenteur, micro-éjecteurs,... pour un total de 30m² environ) de la partie "Caractérisation électrique".

# Option ii:

Si l'on tient compte des contraintes d'infrastructures demandées par les microsystèmes évoquées ci-dessus, associées au fait qu'une localisation en étage n'est pas souhaitable pour les équipements hyperfréquences, optiques et, pour partie, électriques, on peut installer, comme précédemment, les microsystèmes en lieu et place de l'actuelle salle blanche. Dans ce cas, aucun des autres blocs ne peut être implanté dans le bâtiment C, par manque de place.

#### Option iii:

Enfin, une 3<sup>ème</sup> option peut être envisagée, associant l'installation au rez-de-chaussée du bâtiment G de la caractérisation électrique, hyperfréquences et optique (comme proposée dans

l'option i), et le rapprochement du bloc "Microsystèmes", installé dans une partie du 1<sup>er</sup> étage du même bâtiment (partie Ouest).

Cette proposition laisse libre les salles du bâtiment C, et l'équivalent d'une salle de réunion dans le bâtiment G, et permet en outre une meilleure interaction entre les différents blocs (séparation Microsystèmes/Electrique évoquée dans l'option i résolue) ainsi une plus grande proximité de l'aire "Microsystèmes" avec la nouvelle salle blanche (zones Caractérisations Physiques, AFM, Chimie Assemblage, etc) située en vis-à-vis.

# 4.5 Descriptif des expérimentations

Le descriptif complet des expérimentations est joint à ce document.

#### Conclusion

Ce travail de recensement, de synthèse et de projection dans l'avenir résulte aussi de l'évolution de notre vision, en tant que membres de la cellule, des installations expérimentales au laboratoire, et s'appuie sur de très nombreux débats et discussions avec toutes les personnes concernées, afin de converger vers une solution partagée et soutenue par tous.

Les travaux présentés ici mettent en avant l'idée d'un Centre de caractérisation scientifiquement et techniquement riche, d'une part grâce à la pertinence des expérimentations qu'il développe, et d'autre part grâce à la mutualisation des personnes et des compétences qu'il rassemble.